

## ВЛИЯНИЕ ПЛАВНЫХ ФЛУКТУАЦИЙ СОСТАВА ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ТВЕРДОГО РАСТВОРА НА ФОРМУ КРАЯ СОБСТВЕННОГО ПОГЛОЩЕНИЯ

С.Н. Артеменко, А.Я. Шульман

С помощью квазиклассического приближения вычислена зависимость эффективного коэффициента поглощения света  $\bar{K}(\omega)$  от частоты вблизи края фундаментальной полосы в полупроводниковых твердых растворах с учетом неизбежных флуктуаций состава и ширины запрещенной зоны  $\mathcal{E}_g$ . Для случая пластинки из материала, в котором свет поглощается за счет разрешенных прямых междузонных переходов, вместо обычного закона  $\bar{K}(\omega) \sim \sqrt{\hbar\omega - \mathcal{E}_g}$  будет измерено  $\bar{K}(\omega) \sim (\hbar\omega - \mathcal{E}_g)^{3/2}$  либо  $(\hbar\omega - \mathcal{E}_g)^1$  в зависимости от характера изменения  $\mathcal{E}_g$  с толщиной пластинки.

Зависимость коэффициента оптического поглощения  $K$  от частоты  $\omega$  вблизи края собственного поглощения используется для определения типа междузонных переходов, с которыми связано поглощение света в полупроводниках. В случае полупроводниковых твердых растворов, когда ширина запрещенной зоны  $\mathcal{E}_g$  сильно зависит от состава, неизбежные неоднородности в распределении компонент раствора вызовут пространственные вариации  $\mathcal{E}_g$ , которые, как мы покажем, могут существенно изменить наблюдаемую форму края поглощения. Неучет этого обстоятельства приведет к неверным выводам о типе междузонных переходов.

Будем рассматривать длинноволновую часть пространственного спектра флуктуаций концентрации компонент твердого раствора, которую можно учесть, введя локальную ширину запрещенной зоны  $\mathcal{E}_g(\mathbf{r})$  и локальную комплексную диэлектрическую проницаемость  $\epsilon(\omega, \mathbf{r}) = \epsilon_1 + i\epsilon_2$ . Такое описание оптических характеристик твердого раствора должно быть достаточно точным, когда концентрация мало меняется на длине волны света в веществе  $\lambda$ , и позволяет свести анализ оптических свойств

неоднородного твердого раствора к задаче о распространении электромагнитной волны в среде с плавно меняющейся  $\epsilon(r)$

Выражение для коэффициента пропускания  $T(\omega)$  полупроводниковой пластинки, оптические свойства которой меняются по толщине, может быть получено из двух линейно независимых решений  $E_+(x)$ ,  $E_-(x)$  волнового уравнения для вектора  $E$  электрического поля. Если выбрать направление изменения  $\epsilon$  за ось  $x$ , то для поперечных волн, распространяющихся вдоль  $Ox$ , справедливо уравнение

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} + \frac{\omega^2}{c^2} \epsilon(x) E = 0. \quad (1)$$

В квазиклассическом приближении

$$E_+(x) = E_0 [\epsilon(x)/\epsilon(0)]^{-1/4} \exp \left[ i \frac{\omega}{c} \int_0^x \sqrt{\epsilon(x')} dx' \right], \quad (2a)$$

$$E_-(x) = E_0 [\epsilon(x)/\epsilon(0)]^{-1/4} \exp \left[ -i \frac{\omega}{c} \int_0^x \sqrt{\epsilon(x')} dx' \right], \quad (2b)$$

где  $E_+$  соответствует уходящей на  $+\infty$  волне, а  $E_-$  — приходящей из  $+\infty$ . Желая определить зависимость  $T(\omega)$  в окрестности края собственного поглощения, мы можем положить  $\epsilon_1 \gg \epsilon_2$ , т. е. считать поглощение на длине волны в веществе малым. Это справедливо вплоть до значений  $K \approx 10^4 + 10^5 \text{ см}^{-1}$  [1]. Тогда для пластины толщиной  $d$ :

$$T(\omega) = \frac{[1 - R(d)][1 - R(0)] e^{-\bar{K}(\omega)d}}{1 + R(d)R(0)e^{-2K(\omega)d} - 2\sqrt{R(d)R(0)}e^{-K(\omega)d} \cos 2\kappa}, \quad (3)$$

где  $R(0)$  и  $R(d)$  — коэффициенты отражения от передней и задней грани пластинки;  $\kappa = \frac{\omega}{c} \int_0^d \sqrt{\epsilon_1(x)} dx$ ,

$$\bar{K}(\omega) = \frac{1}{d} \int_0^d K(\omega, x) dx; \quad K(\omega, x) = \frac{\omega}{c} \frac{\epsilon_2(\omega, x)}{2\sqrt{\epsilon_1(\omega, x)}}. \quad (4)$$

Видно, что в случае однородной пластинки  $\bar{K}(\omega)$  переходит в обычный коэффициент поглощения. Если изменение  $\epsilon_g$  внутри пластинки не превосходит  $0,1 \epsilon_g$ , то при определении  $\bar{K}(\omega)$  из (3) в первом приближении можно положить  $R(d) = R(0)$ , так как нетрудно показать, что  $(\epsilon_1 \gg 1)$

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\sqrt{\epsilon_1}}{\epsilon_1 - 1} \frac{\Delta \epsilon_1}{\epsilon_1} \quad \text{и} \quad \frac{\Delta R}{1 - R} = \frac{1}{4} [1 + R] \frac{\Delta \epsilon_1}{\epsilon_1},$$

а из эмпирической формулы Мосса  $1/\epsilon_1^2 \sim \epsilon_g$  [1] следует, что  $\Delta \epsilon_1/\epsilon_1 = 2 \Delta \epsilon_g/\epsilon_g$ . Тогда формула (3) становится очень похожей на известное выражение для пропускания однородной пластинки, в котором роль эффективного коэффициента поглощения играет  $\bar{K}(\omega)$ . Как будет по-

казано, его частотная зависимость существенно отличается от частотной зависимости локального коэффициента поглощения  $K(\omega, x)$ , когда  $\min \mathcal{E}_g(x) < \hbar\omega < \max \mathcal{E}_g(x)$ . Видно, что при обычном определении поглощения пластинки по пропусканию будет измерен как раз  $\bar{K}(\omega)$ .

Полагая, что состав твердого раствора, а значит и  $\mathcal{E}_g$  мало меняются на расстояниях порядка  $d$ , и ограничиваясь в разложении  $\mathcal{E}_g(x)$

членами второго порядка  $\mathcal{E}_g(x) = \mathcal{E}_g(0) + \mathcal{E}'_g x + \frac{1}{2} \mathcal{E}''_g x^2$ , исследуем зависимость  $\bar{K}(\omega)$  в случае, когда поглощение света определяется разрешенными прямыми переходами из валентной зоны в зону проводимости. При этом<sup>1)</sup>

$$K(\omega, x) \sim [\hbar\omega - \mathcal{E}_g(x)]^{1/2}.$$

Тогда поглощение вблизи края начинает расти по характерному для запрещенных прямых переходов закону

$$\bar{K}(\omega) \sim [\hbar\omega - \mathcal{E}_{g \min}]^{3/2}, \quad (5a)$$

если  $\partial \mathcal{E}_g / \partial x > (\partial^2 \mathcal{E}_g / \partial x^2) d$  в точке, где ширина запрещенной зоны минимальна (рис. а) и

$$\bar{K}(\omega) \sim [\hbar\omega - \mathcal{E}_{g \min}], \quad (5b)$$

если минимум  $\mathcal{E}_g(x)$  достигается внутри пластинки ( $\partial \mathcal{E}_{g \min} / \partial x = 0$ )

(рис. б)<sup>2)</sup>. При  $\hbar\omega > \mathcal{E}_{g \max}$  вид  $\bar{K}(\omega)$  приближается к обычной для разрешенных переходов корневой зависимости. На частоте равной максимальному значению  $\mathcal{E}_g$ , где  $\bar{K}(\omega)$  непрерывно,  $d^2 \bar{K}(\omega) / d\omega^2$  имеет особенность. Характер этой особенности

$$(\hbar\omega - \mathcal{E}_{g \max})^{-1}, \quad (6a)$$

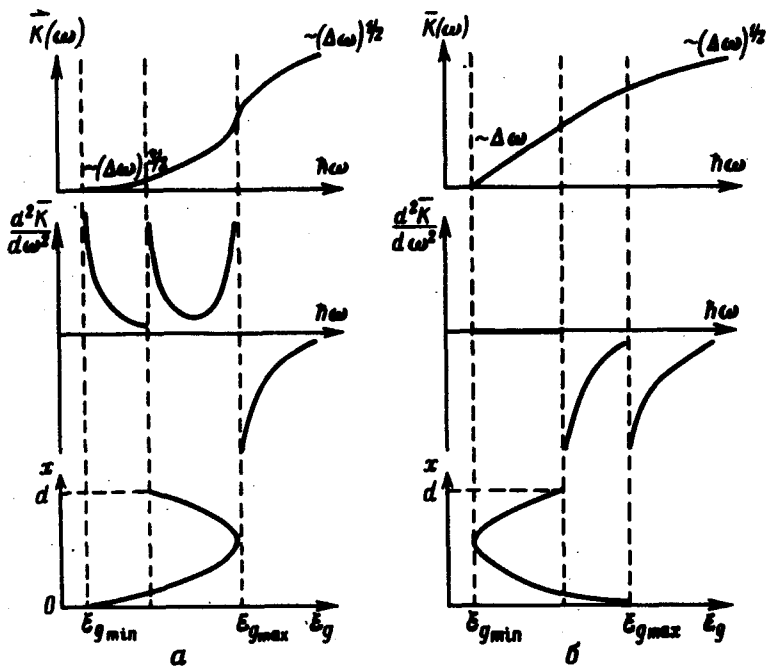
если  $\max \mathcal{E}_g(x)$  достигается внутри пластинки (рис. а) и

$$(\hbar\omega - \mathcal{E}_{g \max})^{-1/2} \quad (6b)$$

если в максимуме  $\partial \mathcal{E}_g / \partial x \neq 0$  (рис. б). Таким образом по частотной зависимости  $\bar{K}(\omega)$  можно судить о виде и характерных значениях функции  $\mathcal{E}_g(x)$ .

<sup>1)</sup> Мы отвлекаемся здесь от похожего на эффект Келдыша – Франца изменения локального коэффициента поглощения, которое может быть в такой неоднородной системе. Этот вопрос будет рассмотрен в другом месте.

<sup>2)</sup> Формулы (5) дают асимптотику  $\bar{K}(\omega)$  в двух предельных и, как нам кажется, наиболее вероятных случаях. Точные выражения легко получить, выполнив интегрирование в (4).



Схематическое изображение частотной зависимости эффективного коэффициента поглощения  $\bar{K}(\omega)$  при различном виде изменения  $\epsilon_g$  по толщине пластинки  $\Delta\omega = \omega - \epsilon_{g\min}/\hbar$

Отметим, что в случае прямых разрешенных переходов  $\partial\epsilon_2/\partial x \sim [\hbar\omega - \epsilon_g(x)]^{-1/2}$  и обычное условие применимости квазиклассики нарушается вблизи особой точки, где  $\epsilon_2(\omega, x) = 0$ . Тем не менее использование решений (2) для вычисления коэффициента поглощения оправдано и в этом случае, как можно убедиться, исследуя поведение решений уравнения (1) в окрестности особой точки. Анализ показывает, что точное решение остается вместе со своими производными конечным в особой точке и хорошо аппроксимируется квазиклассическими формулами (2) при удалении от нее на расстояния большие  $\lambda$ . Из-за малости поглощения на длине волны отличие квазиклассического решения от точного не существенно при вычислении поглощения пластинки толщиной  $d \gg \lambda$ . Остаются в силе и результаты, касающиеся поведения  $d^2\bar{K}/d\omega^2$ , за тем исключением, что рост ее в особых точках будет ограничен. Порядок величины  $d^2\bar{K}/d\omega^2$  вблизи особых точек можно оценить, подставив в (6)  $\hbar\omega - \epsilon_{g\max} = \max\{(\partial\epsilon_g/\partial x)\lambda, (\partial^2\epsilon_g/\partial x^2)\lambda^2\}$ , где производные берутся в особой точке  $\epsilon_2(\epsilon_{g\max}/\hbar, x) = 0$ . Влияние неоднородности состава в плоскости, перпендикулярной направлению распространения света, если флуктуации  $\epsilon_g$  по-прежнему малы по сравнению с  $\lambda$ , можно рассмотреть с помощью трехмерного квазиклассического приближения. При этом выясняется, что выражение для  $T(\omega)$  может быть получено усреднением (3) по площади пластинки. Однако реальные случаи, когда флуктуации состава вдоль направления роста кристалла могут быть существеннее флуктуаций в поперечном

направлении. Если пластинка для исследования поглощения вырезана перпендикулярно направлению роста, то ее пропускание должно хорошо описываться формулой (3).

В заключение отметим, что в работе [2] сообщалось об обнаружении зависимости вида (5а) при исследовании формы края поглощения в твердом растворе  $\text{Bi}_x\text{Sb}_{1-x}$ , хотя оптическое поглощение в этом веществе должно быть связано с разрешенными прямыми переходами. Это противоречие, с нашей точки зрения, объясняется изменением концентрации сурьмы по толщине пластинки, причем для наблюдавшейся в интервале  $\sim 2 \text{ мкв}$  зависимости  $\bar{K}(\omega)$  достаточно, чтобы концентрация сурьмы менялась на 1%.

Мы признательны Т.М.Лифшицу и Е.Г.Чирковой за дискуссии и ознакомление с экспериментальными результатами до публикации, а также Ш.М.Когану за критику.

Институт радиотехники  
и электроники  
Академии наук СССР

Поступила в редакцию  
12 октября 1973 г.

#### Литература

- [1] Т.Мосс. Оптические свойства полупроводников. ИИЛ, 1961.  
[2] А.А.Абдуллаев, В.Г.Алексеева, Н.Ф.Засц, Т.М.Лифшиц, А.Б.Ормонт, Е.Г.Чиркова. Письма в ЖЭТФ, 17, 292, 1973.
-